

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL  
– INMETRO –

CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DE  
ANALISTA EXECUTIVO EM METROLOGIA E QUALIDADE, ASSISTENTE EXECUTIVO EM  
METROLOGIA E QUALIDADE, PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E  
QUALIDADE E TÉCNICO EM METROLOGIA E QUALIDADE

EDITAL N.º 5 – INMETRO, DE 27 DE SETEMBRO DE 2010

O INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL (INMETRO) torna públicas as **retificações** do Edital n.º 1 – INMETRO, de 16 de setembro de 2010, publicado no *Diário Oficial da União* de 17 de setembro de 2010, Seção 3, páginas 164 a 184, conforme a seguir especificado.

1. Retificação dos requisitos para os cargos 30, 31, 32, 33, 34, 45 e 46 constante do subitem 2.3:

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, ou certificado de conclusão de curso de graduação plena de nível superior em uma das seguintes áreas: Agronomia, Ciências Biológicas, Biologia, Biomedicina, Biofísica, Microbiologia, Farmácia, Física, Medicina, Medicina Veterinária, Química ou Zootecnia, expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

2. Retificação dos conhecimentos específicos constantes do subitem 16.2.1.2 referentes ao Cargo 34:

**CARGO 34: PESQUISADOR-TECNOLOGISTA EM METROLOGIA E QUALIDADE – ÁREA: METROLOGIA APLICADA À MICROSCOPIA ÓPTICA**

1 Princípio e aplicação das microscopias de campo claro, campo escuro, contraste de fase, contraste interferencial diferencial e de fluorescência. 2 Princípio e aplicação de vídeo microscopia. 3 Componentes e funcionamento do microscópio óptico em suas diferentes modalidades. 4 Fluorocromos: aplicação, propriedade, especificidade e filtros. 5 Princípio, aplicação, componentes e funcionamento do microscópio confocal de varredura a laser e microscópio multi-fóton. 6 Princípio e aplicação da microscopia de fluorescência espectral. 7 Princípios e aplicação das técnicas de: imunofluorescência, FISH, FRET, FRAP e Deconvolução.

3. Retificação do cargo 52, constante dos subitens 2.5 e 16.2.1.2:

**CARGO 52: TÉCNICO EM METROLOGIA E QUALIDADE – ÁREA: CONTABILIDADE**

4. Retificação dos requisitos para o cargo 58 constante do subitem 2.5:

**CARGO 58: TÉCNICO EM METROLOGIA E QUALIDADE – ÁREA: METROLOGIA**

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, ou certificado de conclusão de curso de educação profissional técnica de nível médio (antigo segundo grau profissionalizante) em Metrologia, Mecânica, Mecatrônica (ou áreas análogas), Automação Industrial, Eletromecânica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Eletrônica (em qualquer ênfase), Elétrica (qualquer ênfase) ou Química, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou Conselho Regional de Química (CRQ), como técnico.

5. Retificação dos requisitos para o cargo 59 constante do subitem 2.5:

**CARGO 59: TÉCNICO EM METROLOGIA E QUALIDADE – ÁREA: METROLOGIA CIENTÍFICA**

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, ou certificado de conclusão de curso de educação profissional técnica de nível médio (antigo segundo grau profissionalizante) em Metrologia, Mecânica, Mecatrônica (ou áreas análogas), Automação Industrial, Eletromecânica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Eletrônica (em qualquer ênfase), Elétrica (qualquer ênfase) ou Química, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) ou registro no Conselho Regional de Química (CRQ), como técnico.

6. Retificação dos requisitos para o cargo 60 constante do subitem 2.5:

**CARGO 60: TÉCNICO EM METROLOGIA E QUALIDADE – ÁREA: METROLOGIA QUÍMICA**

REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, ou certificado de conclusão de curso de educação profissional técnica de nível médio (antigo segundo grau profissionalizante) em Química (em qualquer ênfase) ou Metrologia, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, com registro no Conselho Regional de Química (CRQ), como técnico.

7. Retificação do subitem 10.1.8:

10.1.8 Os candidatos excluídos do disposto no subitem 10.1.6 serão ordenados por cargo/área de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas que será a soma algébrica das notas obtidas nas provas objetivas  $P_1$  e  $P_2$ , respectivamente  $R_1$  e  $R_2$ .

8. Retificação de convocação constante do subitem 10.3:

10.3 Serão convocados os candidatos para a avaliação de títulos e experiência profissional os candidatos aos cargos de nível superior não eliminados na prova discursiva.

9. Retificação da obtenção da nota final para os candidatos aos cargos de nível superior constante do subitem 11.1:

11.1 Para os candidatos aos cargos de nível superior, a nota final no concurso será igual à soma algébrica da nota final obtida nas provas objetivas, da nota final obtida na prova discursiva e da pontuação final obtida na avaliação de títulos e experiência profissional.

10. Retificação da obtenção da nota final para os candidatos aos cargos de nível médio constante do subitem 11.2:

11.2 Para os candidatos aos cargos de nível médio, a nota final no concurso será igual à soma algébrica da nota final obtida nas provas objetivas e da pontuação final obtida na avaliação de títulos e experiência profissional.

11. Retificação da Tabela do Anexo IV relativa ao quantitativo de provas discursivas a serem corrigidas:

**ANEXO IV**  
**QUANTITATIVO DE PROVAS DISCURSIVAS A SEREM CORRIGIDAS**

CARGO/ÁREA	Geral	Portadores de deficiência
1 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Assistente Social	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
2 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Avaliação da Conformidade	60. <sup>a</sup>	6. <sup>a</sup>
3 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Ciências Contábeis	42. <sup>a</sup>	6. <sup>a</sup>
4 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Estatística	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
5 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Gestão Pública	84. <sup>a</sup>	6. <sup>a</sup>
6 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Medicina – Cardiologia	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
7 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Medicina – Ortopedia e Traumatologia	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
8 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Medicina – Psiquiatria	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
9 – Analista Executivo em Metrologia e Qualidade/Medicina do Trabalho	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
10 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Acreditação	96. <sup>a</sup>	6. <sup>a</sup>
11 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Análise de Requisitos e Qualidade de Software	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
12 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Arquitetura de Soluções de Softwares	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
13 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Articulação Internacional	18. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
14 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Ciência da Computação	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
15 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Ciências Econômicas	24. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
16 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Desenvolvimento de Sistemas	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>

17 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Educação a distância	24. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
18 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Engenharia Civil	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
19 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Engenharia Elétrica	30. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
20 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Engenharia Eletrônica	18. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
21 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Engenharia Mecânica	36. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
22 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Engenharia de Produção	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
23 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Engenharia de Segurança do Trabalho	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
24 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Gestão da Informação	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
25 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Governança de Tecnologia da Informação	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
26 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Infraestrutura e Redes de Tecnologia da Informação	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
27 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Informática aplicada à Metrologia Legal	18. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
28 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Instrumentação em Dinâmica dos Fluidos	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
29 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia Acústica e Vibrações	18. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
30 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia Aplicada à Bioquímica e à Biologia Molecular	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
31 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia Aplicada ao Cultivo de Células	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
32 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia Aplicada ao Cultivo de Células Animais	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
33 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia Aplicada à Microscopia de Macromoléculas	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
34 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia Aplicada à Microscopia Óptica	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
35 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia da Dinâmica dos Fluidos	18. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
36 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia de Grandezas Eletromagnéticas	24. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
37 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia legal	54. <sup>a</sup>	6. <sup>a</sup>
38 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia em Grandezas Ópticas	18. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
39 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia em Grandezas Térmicas	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
40 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia em Mecânica	24. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
41 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia de Materiais – OPÇÃO 1	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>

42 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia de Materiais – OPÇÃO 2	12. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
43 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia em Química – OPÇÃO 1	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
44 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Metrologia em Química – OPÇÃO 2	24. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
45 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Microscopia Eletrônica	18. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
46 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Microscopia Forense	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
47 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Psicologia	6. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>
48 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Recursos Humanos	36. <sup>a</sup>	6. <sup>a</sup>
49 – Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade/Tecnologia e Inovação	18. <sup>a</sup>	1. <sup>a</sup>

JOÃO ALZIRO HERZ DA JORNADA  
Presidente do Inmetro